电容电感测量装置

摘要

本设计实现的电容电感测量装置以 STM32F4 为主控制器,利用自平衡电桥和串联谐振电路实现对电容电感的测量。系统由主控制器 STM32F4、信号发生器 AD9959、自平衡电桥电路、RLC 谐振电路、相位检测器 AD8302 和串口屏组成。本系统用信号发生器产生正弦信号,分别进入自平衡电桥电路和串联谐振电路,测量幅值和相位信息以后,可计算得到待测元件的容值、D值、L值和Q值。

关键字: STM32F4; 自平衡电桥; AD8302; 串联谐振

一、系统方案

1.1 方案比较与选择

1.1.1 电容测量方案选择

方案一:利用自平衡电桥。电桥输入给定的正弦信号,通过测量输入信号与输出信号之间的相位以及它们的幅值信息,计算待测电容的 C 值和 D 值。

方案二:利用正交信号源对被测信号进行正交分解,求得被测元件阻抗模与辐角,进一步根据被测元件等效模型计算得到它们都耗散因子,品质因素。

方案选择: 方案二利用双路信号,两个混频器作正交解调,电路结构复杂,由于混频系数受频率、幅度、输入直流失调等因素影响,误差难以消除,且输出直流量与输入幅值呈一次关系,测量动态范围较小。方案一通过相位幅度检波芯片测量幅度、相位信息,检波器芯片输出的直流量与增益 dB、相位差呈线性关系,同时幅度电压比与增益呈对数关系,测量范围大适用于高动态范围的测量,且电路结构简单。综合考虑,使用方案一。

1.1.2 电感测量方案选择

方案一: 使用自平衡电桥, 同电容测量方案。

方案二: RLC 谐振电路。将待测电感与已知阻容串联,通过 DDS 输入频率变换的扫频正弦信号。利用谐振点电路电流最大的特性找到谐振点对应的频率,从而计算待测电感的 L 值和 Q 值。

方案选择:由于高Q值的电感测量需要高频的输入信号,电桥的输入信号频率通常是kHz级别,而谐振电路的输入信号频率通常是MHz级别,故选择方案二。

1.1.3 信号相位与幅度测量方案选择

方案一: ADC 直接采样。通过 MCu 的 ADC 直接采集电桥输入输出两路信号, MCU 直接分析增益与相位差。

方案二: AD8302。将输入输出信号同时传输到 AD8302 检波电路中, AD8302 集成了两个对数放大器,同时对两路信号进行测量并输出增益与相位差。

方案选择:由于方案一对 ADC 的采样率和主控频率的要求很高而方案二的电路设计简单,且精度较高,故选择方案二。

1.2 方案描述

1.2.1 系统框图

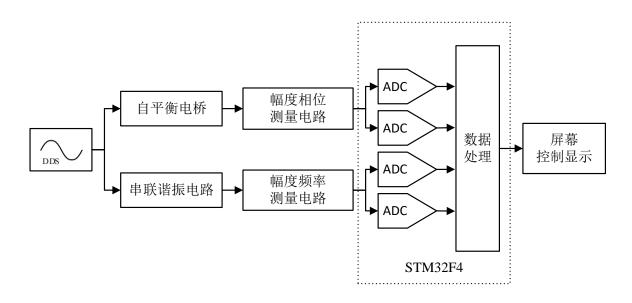


图1 系统框图

1.2.2 总体思路

本系统使用 STM32F4 作为主控制器。测量电容时,固定频率的信号输入自平衡电桥电路,输入输出信号接入 AD8302,单片机采集 AD8302 的输出后数据处理得到增益与相位差信息,计算待测电容的 C 值和 D 值。测量电感时,DDS 产生频率可变的扫频信号输入 RLC 谐振电路,使电路达到谐振点,记录谐振频率,计算待测电感的 L 值和 Q 值。

二、理论分析计算

2.1 自平衡电桥法测量电容分析与计算

在自平衡电桥实现调零时, 电路输入信号 U_{in} 与输出信号 U_{out} 满足运放"虚短""虚断"条件, 有:

$$\frac{U_{in}}{\mathbf{Z_x}} = -\frac{U_{out}}{R_f} \tag{1}$$

读取到输入输出信号的相位差 $\Delta \varphi$ 与幅度比 A_V ,进而可以计算待测电容的 C 值和 D 值。

$$R_{x} = |\mathbf{Z}_{x}'| \sin \Delta \varphi - R_{s} \tag{2}$$

$$X_c = |\mathbf{Z}_{\mathbf{x}}'| \cos \Delta \varphi \tag{3}$$

$$C_{x} = \frac{1}{2\pi f X_{C}} \tag{4}$$

$$D = 2\pi R_x C_x \tag{5}$$

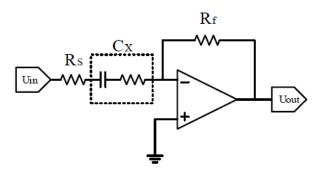


图 2 自平衡电桥

2.2 串联谐振法测量电感分析与计算

当输入频率满足下式时:

$$f = f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \tag{6}$$

电路达到谐振,电路输入信号 U_{in} 与输出信号 U_{out} 满足相位差为 0 条件,电路呈阻性,根据电容值,计算得到电感值

$$L_x = \frac{1}{\left(2\pi f_r\right)^2 C} \tag{7}$$

由电阻分压, 计算出电感等效电阻 RL 和品质因数 Q:

$$\frac{U_{out}}{RSL} = \frac{U_{in}}{R_C + R_L + R_C} \tag{8}$$

$$R_L = (\frac{U_{in}}{U_{out}} - 1)R_S - R_C \tag{9}$$

$$Q = \frac{2\pi f_r L}{R_L} \tag{10}$$

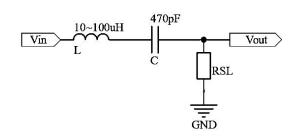


图 3 串联谐振电路

三、电路与程序设计

3.1 电路设计

3.1.1 自平衡电桥设计

自平衡电桥电路如图 4所示,分为两级电路。第一级为电桥电路,电阻 R_S 和 R_F 的值根据待测电容的容值大小进行分档取值,如表 1所示。第二级为反向放大电路,将前后信号的相位差控制在 AD8302 的工作范围内。

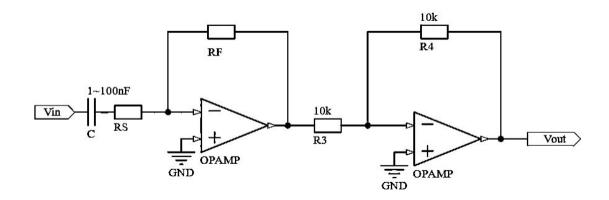


图 4 自平衡电桥电路

表1 RF和RS的取值

待测电容容值	R_{F}	R_{S}	挡位
1 ~5nF	4.1ΚΩ	1.8ΚΩ	<u> </u>
8 ~30nF	508Ω	218Ω	
30 ~100nF	180Ω	60Ω	11

3.1.2 RLC 谐振电路设计

RLC 谐振电路如图 5所示, RSL 的取值根据待测电感的 L 值和 Q 值确定,通过计算 L/Q 估计待测电感等效串联电阻的大小并据此选择合适的 RSL 挡位,如表 2所示。

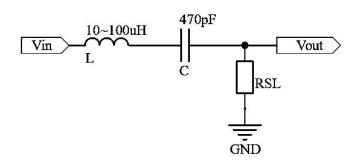


图 5 谐振电路设计

待测电感 L/Q	RSL	挡位
0.05 ~10 μΗ	10Ω	
10 ~30 μΗ	50Ω	
30 ~100 μH	402Ω	三

表 2 RSL 的取值

3.2 软件程序设计

本设计由 STM32F4 为主控制器,实现 DDS 模块的驱动、AD8302 输出信号的采集、串联及反馈电阻的自动分档调节、串口屏的人机交互。上电时,MCU 发出指令对整个系统进行初始化,ADC 进行自校准,根据串口屏发出的测量指令进入电容测量模式或者电感测量模式。

测量电容时,首先 MCU 控制 DDS 输出 20kHz 的正弦信号,待电路稳定后,先将选择电阻挡位为二档,测量 AD8302 输出信号计算电容容值并据此进行判断并据此选择合适的电阻挡位,之后重新测量计算待测电容的 C 值和 D 值。

测量电感时,首先 MCU 选择电阻挡位为二档,控制 DDS 输出 $20kHz\sim3MHz$ 之间的五等分点频率 f_{00} , f_{10} , f_{20} , f_{30} , f_{40} , 在这 5 个频率点之间找出对应输出电压最大的频率 f_{p0} 以及它的前后距离最近的频率点 f_{pf0} , f_{pb0} 。之后先控制 DDS 输出 $f_{pf0}\sim f_{pb0}$ 之间的五等分点频率 f_{00} , f_{10} , f_{20} , f_{30} , f_{40} , 重复之前的操作。当 $f_{pbn}-f_{pfn}<1kHz$ 时,停止扫频操作,取 $f_{max}=\frac{f_{pbn}+f_{pfn}}{2}$,作为测得谐振电路的谐振频率。在这个频率下,计算待测电感的 L 值和 Q 值并据此进行判断选择合适的电阻档位,之后重新进行扫频和计算待测电感的 L 值和 Q 值。

主程序的流程图如图 6所示:

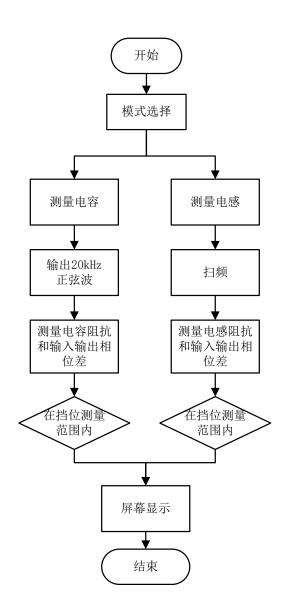


图 6 程序流程图

四、测试方案与测试结果

4.1 测试环境

设备	品牌	型号		
示波器	GWINSTEK	MDO-2204ES 型数字示波器		
信号发生器	RIGOL	DG1062 型信号发生器		
电源	RIGOL	DP832 型稳压源		
LCR 测试仪	GWINSTEK	LCR-6300 型 LCR 测试仪		
Q表	爱仪	QBG-3E型全数显高频Q表		

4.2 测试结果

4.2.1 电容量 C 及其损耗角正切 D 的测量测试

系统开机,接入 C 值在 1 到 100nF, D 值在 0.005 到 1 的样品电容,系统输出 20kHz 的正弦信号进行电容测量。记录系统测量的电容值 C、损耗角正切 D 和测量时间,与 LCR 测试仪测量的标准值对比,计算误差,测量结果如表 3 所示。

表 3 电容量 C 及其损耗角正切 D 的测试结果记录表

序号	C 标准值	C 测量值	相对误差	D 标准值	D 测量值	相对误差	测量时间
1	29.45nF	28.78nF	-2.3%	0.702	0.685	-2.4%	0.9s
2	4.72nF	4.89nF	3.6%	0.205	0.199	-2.9%	0.7s
3	1.02nF	1.04nF	2.0%	0.036	0.035	-2.8%	0.8s
4	86.65nF	86.55nF	-2.1%	0.172	0.175	1.9%	0.8s
5	14.07nF	14.69nF	4.4%	0.166	0.158	-4.8%	0.8s

参考文献

- [1] 罗杰. 谢自美. 电子线路. 设计·实验·测试 (第五版),2015, 电子工业出版社.
- [2] 康华光. 电子技术基础 (模拟部分)(第六版).2013, 高等教育出版社.
- [3] [美]Bruce Carter. 运算放大器权威指南 (第四版)2014, 人民邮电出版社.
- [4] 全国大学生电子设计竞赛组委会. 第十一届全国大学生电子设计竞赛获奖作品选编, 北京理工大学出版社.